

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ОБРАЗЦОВ P-InSb С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ НЕСКОМПЕНСИРОВАННЫХ АКЦЕПТОРОВ $6 \cdot 10^{11} - 1 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$

Ф.Ф.Харахорин, М.Ф.Полубояринова, В.Г.Виноградова

В исследованиях свойств антимонида индия р-типа большой интерес в настоящее время проявляется к выяснению вопроса о природе и положении энергетических уровней примесей, и, в частности, так называемого глубокого уровня. Обнаружению глубокого уровня в антимониде индия р-типа посвящено уже несколько работ [1-5]. Однако единой точки зрения относительно природы и характера этого уровня пока не существует. Можно надеяться, что расширение области исследования (по температуре, концентрации носителей, числу легирующих акцепторных элементов) позволит найти новые подходы к решению этой задачи.

В настоящей работе на компенсированных (степень компенсации выше 90%) образцах антимонида индия р-типа с удельным сопротивлением от 10 до 2740 $\text{ом} \cdot \text{см}$ и низкой концентрацией нескомпенсированных дырок ($6 \cdot 10^{11} - 1 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$) в интервале от 4,2 до 300°К измерялись температурные зависимости коэффициентов Холла, электропроводности и подвижности. Монокристаллы легировались акцепторными примесями (марганцем, кремнием, германием, золотом) в процессе вытягивания по методу Чохральского.

В области 55-130°К более чем на 40 образцах исследованы температурные зависимости концентраций дырок, определенной как $P = 1/Rec$. Оказалось, что независимо от способа получения образца и природы легирующей примеси, глубокий уровень проявляется (имеются в виду соответствующие наклоны кривых [1-5] рис. I в интервале температур 78-110°К) только на образцах с концентрацией носителей $p \sim 6 \cdot 10^{11} - 7 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$.

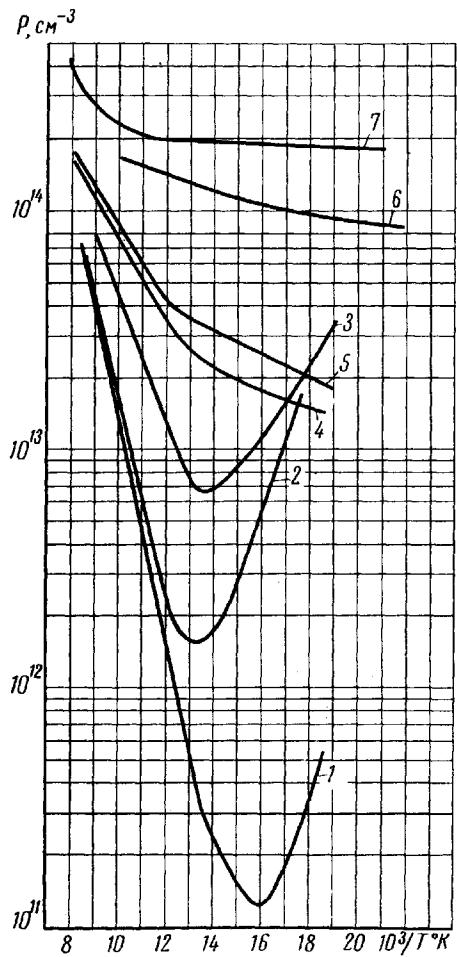


Рис.1. Зависимость концентрации дырок для образцов, легированных различными примесями, от температуры. Обозначения и параметры образцов при $T = 78^\circ\text{K}$ даны в таблице

Таблица

№ обр.	ρ , см^{-3}	ρ , $\text{ом}\cdot\text{см}$	μ , $\text{см}^2/\text{в}\cdot\text{сек}$	Примесь
1	$6,0 \cdot 10^{11}$	$2,74 \cdot 10^3$	$3,84 \cdot 10^3$	Ge
2	$1,6 \cdot 10^{12}$	$9,5 \cdot 10^2$	$4,15 \cdot 10^3$	Ge
3	$7,65 \cdot 10^{12}$	$4,52 \cdot 10^2$	$1,82 \cdot 10^3$	Au
4	$2,6 \cdot 10^{13}$	$4,8 \cdot 10^1$	$5,05 \cdot 10^3$	Mn
5	$3,7 \cdot 10^{13}$	$4,85 \cdot 10^1$	$3,5 \cdot 10^3$	Au
6	$1,3 \cdot 10^{14}$	$1,35 \cdot 10^1$	$3,6 \cdot 10^3$	Ge + Te
7	$2,0 \cdot 10^{14}$	4,5	$6,95 \cdot 10^3$	Ge

При более высоких концентрациях нескомпенсированных дырок он не обнаруживается (кривые 6, 7, рис. 1). Энергия активации глубокого уровня колеблется в зависимости от концентрации носителей в пределах 0,01 – 0,1 эВ. Независимость энергии активации глубокого уровня от сорта легирующей примеси (рис. 2) заставляет предполагать, что этот уровень обусловлен дефектами решетки.

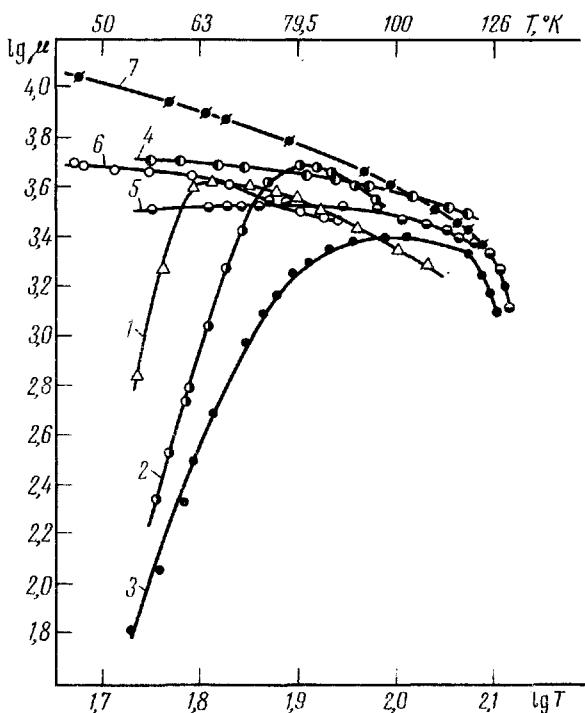


Рис.2. Зависимость энергии активации глубокого уровня от концентрации дырок. Обозначения: \times – InSb + Mn; \circ – InSb + Au; \bullet – InSb + Ge; \blacksquare – зонный; \triangle – термообработанный; \ominus – нестехиометрический расплав

В отличие от работ [1-5] нами измерены образцы с очень низкой концентрацией нескомпенсированных дырок ($6 \cdot 10^{11} - 6 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-3}$), и это позволило обнаружить своеобразный температурный ход коэффициентов Холла и подвижности, заключающийся в том, что, независимо от сорта легирующей примеси: 1) образцы с концентрацией дырок порядка $6 \cdot 10^{11} - 6 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-3}$ имеют четко выраженный минимум в ходе $\mu = f(10^3/T)$, не наблюдающийся у образцов с концентрациями нескомпенсированных дырок порядка $10^{14} - 10^{13} \text{ см}^{-3}$; 2) кривые $\mu = f(T)$ для этих образцов имеют максимум, тогда как при концентрациях дырок $\sim 10^{13} - 10^{14} \text{ см}^{-3}$ наблюдается плавное уменьшение подвижности в этой же области температур (рис. 3).

Такое своеобразное поведение образцов с $p \sim 6 \cdot 10^{11} - 6 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-3}$ не связано со свойствами их поверхности, так как повторные травления, промывки, а также измерения на образцах различной толщины не изменили вида кривых.

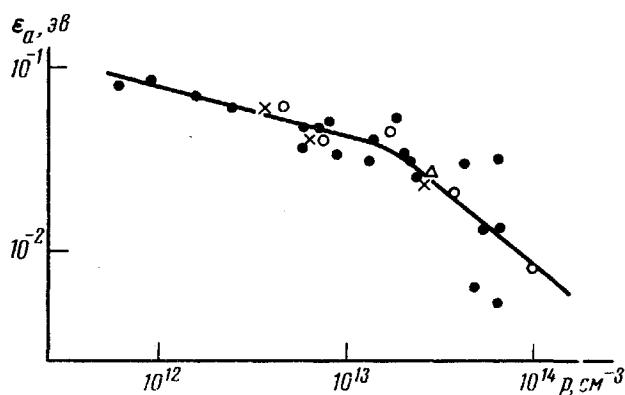


Рис.3. Зависимость подвижности дырок для образцов, легированных различными примесями, от температуры. Обозначения те же, что к рис.1

Ход кривых $p = f(T)$ позволяет предположить существование примесной энергетической зоны, расположенной в запрещенной зоне. Однако концентрации дырок, рассчитанные по модели двух зон [7] (валентной и примесной), не дали удовлетворительного совпадения с экспериментальными кривыми. Измерения коэффициента Холла на тех же образцах антимонида индия p -типа с концентрацией дырок $p \sim 10^{14} - 10^{13} \text{ см}^{-3}$ в области температур 4,2-50°К позволили обнаружить примесную зону, обусловленную мелкими акцепторами. Энергия ионизации их колеблется в пределах $(5-8) \cdot 10^{-3} \text{ эв}$. Раздельно определенные концентрации акцепторов и доноров, например, на образце с концентрацией дырок $p \sim 3 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-3}$ составляли соответственно $N_A = 2,653 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$, $N_D = 2,650 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$ ($N_D/N_A = 99,95\%$). Следует отметить, что максимум на кривых $R = f(10^2/T)$ с уменьшением концентрации носителей сдвигается в сторону более высоких температур. Так, на образцах p -InSb с концентрацией дырок (при $T = 77^\circ\text{K}$) $2,6 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$; $9,85 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$ и $1,47 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$ максимум в $R = f(10^2/T)$ наблюдался соответственно при 18; 11,8 и 6,2°К. На образцах с концентрацией нескомпенсированных дырок $\sim 6 \cdot 10^{11} - 6 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-3}$ примесная зона в области температур ниже 50°К не обнаруживалась.

Обнаруженные в этой работе новые экспериментальные факты пока не могут быть убедительно объяснены. В качестве предварительных соображений можно высказать следующие предположения. 1. Возможно, что максимумы на кривых $R = f(T)$ для образцов с концентрациями $6 \cdot 10^{11} - 6 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-3}$ являются результатом одновременного действия

зоны мелких акцепторов и глубокого дефектного уровня. 2. Можно также предположить, что появление максимума связано с наличием в антимониде индия двух сортов дырок, соотношение концентраций которых меняется под действием ряда факторов. [6]

Поступило в редакцию
5 мая 1967 г.

Литература

- [1] R.A.Laff, H.Y.Fan. Phys.Rev., 121, 53, 1961.
- [2] R.Cunningham, E.Harp, W.Bullis. International Conference on Semiconductor Physics, Exeter, 1962.
- [3] W.Bullis, V.Harrap. International Conference on Semiconductor Physics, Paris, 1964.
- [4] А.Д.Беркалиев, В.В.Галаванов, Д.И.Наследов. ФТТ, 7, № 12, 1965 г.
- [5] Д.И.Наследов, Ю.Г.Попов. ФТТ, 8, 1110, 1966.
- [6] Н.В.Коломоец, М.И.Виноградова, Е.Я.Лев, Л.М.Сысоева. ФТТ, 8, 10, 1966.
- [7] Лянь Чжи-Чао, Д.И.Наследов. ФТТ, 3, № 5, 1965.